



PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

<p>(51) 国際特許分類7 H01L 21/027</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/42640</p> <p>(43) 国際公開日 2000年7月20日(20.07.00)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP00/00182</p> <p>(22) 国際出願日 2000年1月18日(18.01.00)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平11/8986 1999年1月18日(18.01.99) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 ニコン(NIKON CORPORATION)[JP/JP] 〒100-8331 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてののみ) 吉田幸司(YOSHIDA, Kouji)[JP/JP] 〒100-8331 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社 ニコン内 Tokyo, (JP)</p> <p>(74) 代理人 立石篤司(TATEISHI, Atsuji) 〒194-0013 東京都町田市原町田5丁目4番20号 ペセオビル5階 Tokyo, (JP)</p>		<p>(81) 指定国 AE, AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CR, CU, CZ, DM, EE, GD, GE, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MA, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ZA, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>

(54) Title: **PATTERN MATCHING METHOD AND DEVICE, POSITION DETERMINING METHOD AND DEVICE, POSITION ALIGNING METHOD AND DEVICE, EXPOSING METHOD AND DEVICE, AND DEVICE AND ITS PRODUCTION METHOD**

(54) 発明の名称 パターンマッチング方法及び装置、位置検出方法及び装置、位置合わせ方法及び装置、露光方法及び装置、並びにデバイス及びその製造方法

(57) Abstract

A template creating unit (32) creates a waveform template formed of expectations of a signal waveform of the value of each parameter and a probability template formed of information on occurrence probability of each expectation of the parameters on the basis of the signal waveform measured. A matching judging unit (33) performs template matching of another signal waveform measured while using the expectation occurrence probability information included in the probability template as weight information for each parameter value. Further the template creating unit (32) creates a waveform template and a probability template considering the measured another signal waveform and prepares for the next pattern matching. Thus template matching is performed with improved matching accuracy for waveform of a signal varying with the value of a parameter.

